

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2025년 4월 24일 (24.04.2025)



(10) 국제공개번호

WO 2025/084833 A1

- (51) 국제특허분류:
G01R 31/28 (2006.01) H01L 21/677 (2006.01)
G06T 7/70 (2017.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2024/015846
- (22) 국제출원일: 2024년 10월 18일 (18.10.2024)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2023-0140575 2023년 10월 19일 (19.10.2023) KR
10-2023-0140845 2023년 10월 20일 (20.10.2023) KR
10-2023-0142139 2023년 10월 23일 (23.10.2023) KR
10-2024-0099274 2024년 7월 26일 (26.07.2024) KR
10-2024-0140633 2024년 10월 15일 (15.10.2024) KR
- (71) 출원인: 주식회사 테크윙 (TECHWING, INC.) [KR/
KR]; 18487 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37 (KR).
- (72) 발명자: 나윤성 (NA, Yun Sung); 31068 충청남도 천안시
동남구 향교1길 114-7 (KR). 윤상균 (YOON, Sang
Gun); 17857 경기도 평택시 비전2로 297, 102동 1104호
(KR). 유병돈 (YU, Byung Don); 34658 대전광역시 동구
계족로 140번길 33, 108동 104호 (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 빛과소금 (LIGHT AND SALT
PATENT AND LAW FIRM); 08506 서울특별시 금천구
가산디지털2로 98, 1-312호 (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH,

KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

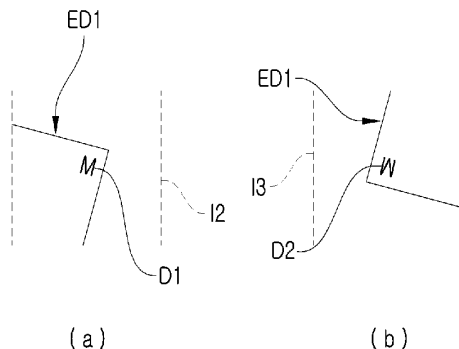
(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: HANDLER FOR TESTING ELECTRONIC DEVICE

(54) 발명의 명칭: 전자부품 테스트용 핸들러



(57) Abstract: The present invention relates to a technology for rearranging an electronic device. According to the present invention, an image obtained by capturing an identification mark of an electronic device loaded on a test table is analyzed to calculate a temporary area for the electronic device and then calculate a movement distance (including rotational movement or horizontal movement) for rearranging the electronic device. Therefore, precise rearrangement of an electronic device is possible, and thus, the reliability of an electrical connection between the electronic device and a tester is improved.

(57) 요약서: 본 발명은 전자부품을 재배치시키기 위한 기술에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 테스트테이블에 적재된 전자부품의 식별마크를 촬영하여 얻은 이미지를 분석하여 전자부품의 임시구역을 계산한 후 전자부품을 재배치시키기 위한 이동거리(회전 이동이나 수평 이동을 포함함)를 계산한다. 따라서 전자부품의 정교한 재배치가 가능하여 전자부품과 테스터 간의 전기적인 연결에 대한 신뢰성이 향상된다.

WO 2025/084833 A1